

異物分析・材料解析セミナー

材料分析における最適な分析技術のご紹介
あらゆる分野において異物による不良品に対する分析及び
解析方法をご紹介

5社共催セミナーのご案内

拝啓 盛夏の候、貴社におかれましてはますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
日頃より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、スペクトリス株式会社、株式会社日本電子、株式会社パーキンエルマー・ジャパン、ブルカー・ジャパン株式会社のご協力による「異物分析・材料解析セミナー」を開催する運びとなりましたので、ご案内いたします。
粒子計測装置、新型卓上走査型顕微鏡、赤外分光分析装置、微小部及びハンディ型蛍光XRFによる最適な分析技術をご紹介させていただきます。また、上記製品の展示、デモンストレーションも行います。

ご多忙の折とは存じますが、是非この機会に本セミナーにご参加を賜りますよう、何卒よろしくご願ひ申し上げます。

敬具



株式会社 新興精機
Shinkouseiki, Co., Ltd.

開催概要

タイトル	環境・材料分析における最適な分析技術のご紹介 あらゆる分野において異物による不良品に対する分析及び解析方法をご紹介
主催	スペクトリス株式会社、株式会社日本電子、株式会社パーキンエルマー・ジャパン、ブルカー・ジャパン株式会社、株式会社新興精機
日程	2019年9月20日(金) 13:00~17:30 (受付開始 12:30)
会場	株式会社新興精機 本社 3階セミナー室 (〒812-0054 福岡市東区馬出6-14-17)
参加費	無料
定員	50名
問合せ	株式会社新興精機セミナー担当:安永 電話:092-624-8010 FAX:092-624-8024 e-mail: yasunaga@shinkouseiki.co.jp

9月20日(金)

12:30	受付開始
13:00-13:05	開会のご挨拶
13:05-13:40	スペクトリス(株): ナノスケールの先端評価と構造評価
13:40-14:15	(株)パーキンエルマージャパン: IRイメージングを活用した微小異物の効率的な分析解析技術
14:15-14:50	日本電子(株): 卓上走査電子顕微鏡による迅速な形状観察、組成解析及び応用例について
14:50-15:00	休憩
15:00-15:40	ブルカージャパン(株): 世界初C~Amのマッピング対応 μ XRF M4 TORNADOのご紹介 (株)新興精機: ハンドヘルドXRFによる新たなアプリケーションの可能性について
15:40-17:20	デモンストレーション (分光光度計FT-IR SP Two、微小部蛍光X線分析装置 M4 TORNADO、ハンドヘルド蛍光X線分析装置S1 TITAN、卓上走査電子顕微鏡 JCM-7000、粒子計測装置 ゼータサイザーナノ)
17:20-17:30	閉会のご挨拶

会場アクセス

会場

株式会社新興精機 本社 3F セミナー室

<http://www.shinkouseiki.co.jp>【住所】〒812-0054 福岡市東区馬出6-14-17
TEL : 092-624-8010

【交通】

JRの場合 / JR博多駅より乗車約3分、
JR吉塚駅下車、徒歩約5分福岡市営地下鉄の場合 / 地下鉄博多駅より
乗車約10分(中洲川端駅で箱崎線・貝塚行に乗り換え)
地下鉄馬出九大病院前駅より下車、徒歩約10分

お車の場合 / 無料駐車場あり



次のような方を対象とした内容となっております

- 分光光度計、蛍光X線分析、電子顕微鏡にご興味をお持ちのお客様
- 粒子計測に興味をお持ちのお客様

お申し込みは新興精機ホームページへ
www.shinkouseiki.co.jp